



中华人民共和国国家标准

GB/T 17554.7—2010

识别卡 测试方法 第7部分：邻近式卡

Identification cards—Test methods—
Part 7: Vicinity cards

(ISO/IEC 10373-7:2008, MOD)

2010-12-01 发布

2011-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、缩略语和符号	1
4 适用于测试方法的默认条款	2
5 静电测试	2
6 测试装置和测试电路	3
7 VICC 的功能测试	6
8 VCD 的功能测试	7
9 VICC 的工作场强测试	8
附录 A (规范性附录) 测试 VCD 天线	9
附录 B (资料性附录) 测试 VCD 天线调谐	11
附录 C (规范性附录) 传感线圈	13
附录 D (规范性附录) 用于 VCD 功率测试的参考 VICC	15
附录 E (资料性附录) 用于负载调制测试的参考 VICC	17
附录 F (资料性附录) 频谱计算程序	18

前 言

GB/T 17554 在《识别卡 测试方法》总标题下,目前分为如下 7 个部分:

- 第 1 部分:一般特性测试;
- 第 2 部分:磁条卡;
- 第 3 部分:带触点的集成电路卡及其相关接口设备;
- 第 4 部分:无触点集成电路卡;
- 第 5 部分:光记忆卡;
- 第 6 部分:接近式卡;
- 第 7 部分:邻近式卡。

本部分为 GB/T 17554 的第 7 部分。本部分使用重新起草法,修改采用国际标准 ISO/IEC 10373-7:2008《识别卡 测试方法 第 7 部分:邻近式卡》(英文版)。

本部分与 ISO/IEC 10373-7:2008 相比,增加和修改了下列内容,并在相应条款的外侧页边空白处用单垂线标示:

- a) 为了使标准更加清晰易懂,增加了缩略语 PCB;
- b) 为了便于引用,8.1.2 做了编辑性修改;
- c) 为了避免实际应用中可能出现在规定的工作区域内 VICC 不能正常工作的情况,增加第 9 章工作场强测试。

本部分的附录 A、附录 C 和附录 D 是规范性附录。

本部分的附录 B、附录 E 和附录 F 是资料性附录。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位:中国电子技术标准化研究所、东信和平智能卡股份有限公司。

本部分主要起草人:冯敬、高林、袁理、金倩、黄小鹏、耿力、赵子渊。

识别卡 测试方法

第 7 部分:邻近式卡

1 范围

GB/T 17554 规定了符合 GB/T 14916 识别卡特性的测试方法。每一测试方法交叉引用一个或多个基础标准,这些基础标准可以是 GB/T 14916 或一个或多个定义了用于识别卡应用的信息存储技术的补充标准。

注 1: 接收准则不包含在本部分中,而是在以上提及的国家标准中。

注 2: GB/T 17554 描述的若干测试方法可单独实施。规定的卡不要求顺序地通过所有测试。

GB/T 17554 的本部分规定了无触点集成电路卡技术(邻近式卡)的测试方法。第 1 部分规定了一种或多种卡技术所共用的测试方法;其他部分则规定了各个专项技术的测试方法。

除非另有规定,本部分中的测试仅适用于 GB/T 22351.1 和 GB/T 22351.2 中定义的邻近式卡。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 17554 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 14916 识别卡 物理特性(GB/T 14916—2006,ISO/IEC 7810:2003,IDT)

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(GB/T 17626.2—2006,IEC 61000-4-2:2001,IDT)

GB/T 22351.1 识别卡 无触点集成电路卡 邻近式卡 第 1 部分:物理特性(GB/T 22351.1—2008,ISO/IEC 15693-1:2000,IDT)

GB/T 22351.2—2010 识别卡 无触点集成电路卡 邻近式卡 第 2 部分:空中接口和初始化(ISO/IEC 15693-2:2000,IDT)

GB/T 22351.3 识别卡 无触点集成电路卡 邻近式卡 第 3 部分:防冲突和传输协议(GB/T 22351.3—2008,ISO/IEC 15693-3:2001,IDT)

ISBN 92-67-10188-9 对度量不确定性表达的指南,ISO,1993 版

3 术语和定义、缩略语和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1.1

基础标准 base standard

利用测试方法验证所要符合的标准。

3.1.2

预期操作 operate as intended

经受了某些潜在破坏性影响作用后,卡上的任何集成电路仍然继续保持了符合 GB/T 22351.3 基础标准的操作和响应¹。

注:若同一张卡上存在其他的技术,则这些技术根据各自的标准也应具有可预期的操作。

1 本部分并不定义集成电路卡的完整功能测试。这些测试方法仅要求验证最小功能。在适合的情况下,可以进一步补充应用特定功能准则,这些准则在一般情况下是用不到的。